XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム データ間隔:1点ごとにフィッティング

母集団: 50 個体数: 50

ターゲットχ²: 1.00e-004

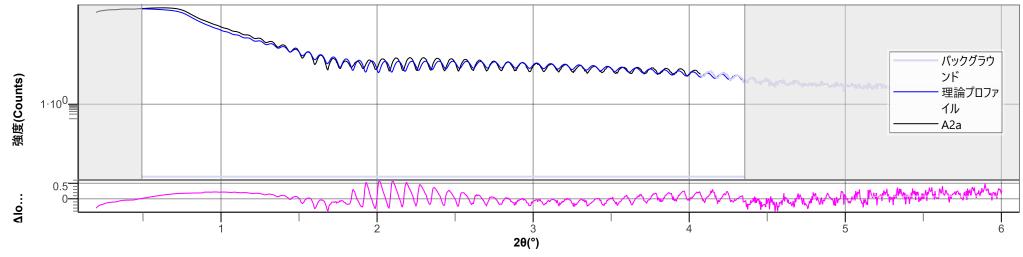
重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼ 材料		膜厚(nm)			密度(g/cm³) <d></d>			粗さ(nm) <rgh></rgh>	
	L2	Fe2O3		2.531	Const	4.95000		Const	0.178	Con
			±0.6		精密化	4.95000	±0.014		精密化	
	1.1	Fe Fe		92.549	Const	7.07400		Const	0.435	Con
	LI		±0.07		精密化	7.97400	±0.012		精密化	
	基板	⊡ Si		∞		2.329	924	Const	0.500	Con